Длинноволновые инжекционные лазеры на основе твердого раствора Pb_{1-x}Sn_xSe и их использование для спектроскопии твердого тела

© К.В. Маремьянин^{+*¶}, А.В. Иконников^{+*}, А.В. Антонов^{+*}, В.В. Румянцев^{+*}, С.В. Морозов^{+*}, Л.С. Бовкун⁺, К.Р. Умбеталиева[‡], Е.Г. Чижевский[‡], И.И. Засавицкий[‡], В.И. Гавриленко^{+*}

⁺ Институт физики микроструктур Российской академии наук,

603950 Нижний Новгород, Россия

* Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,

603950 Нижний Новгород, Россия

[‡] Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук,

119991 Москва, Россия

(Получена 12 апреля 2015 г. Принята к печати 22 апреля 2015 г.)

На основе твердого раствора $Pb_{1-x}Sn_xSe$ разработаны диффузионные лазеры для широкой области спектра (7–40 мкм). Исследованы спектры излучения этих лазеров в интервале температур 18–80 К. Показано, что лазеры перестраиваются с температурой в широких пределах, что позволяет перекрыть диапазон частот 7–26 ТГц. Продемонстрирована возможность использования данных лазеров для спектроскопии твердого тела и в частности для магнитоспектроскопии узкозонных полупроводниковых структур на основе HgCdTe.

1. Введение

Освоение терагерцового (ТГц) диапазона частот (0.1–100 ТГц) — одно из наиболее "горячих" и бурно развивающихся направлений современной физики. Наиболее сложной проблемой в освоении терагерцового диапазона является разработка эффективных методов генерации когерентного ТГц излучения, поскольку в этом диапазоне физические принципы, используемые для генерации оптического и СВЧ излучений, оказываются малоэффективными [1]. Важное практическое значение имеют полупроводниковые инжекционные лазеры, обладающие рядом преимуществ: малые габариты, экономичность питания, возможность изменения частоты излучения в широких пределах. Однако и для этих лазеров в обсуждаемой области электромагнитного спектра имеется пробел, который условно находится на стыке средней и дальней инфракрасной (ИК) областей спектра.

Современные квантовые каскадные лазеры (ККЛ) работают в широком спектральном диапазоне 1–130 ТГц, но имеется окно 5–11 ТГц, где ККЛ не работают, что вызвано близостью полосы остаточных лучей в используемых материалах GaInAs/AlInAs и GaAs/AlGaAs, где сильно решеточное поглощение. Следовательно, для разработки ККЛ необходимы материалы с другими значениями энергии фононов, т.е. с другой спектральной полосой остаточных лучей и двухфононного поглощения. Поиски таких гетероструктур для ККЛ пока не увенчались успехом.

Классические диодные лазеры практически не разрабатывались для частот < 15 ТГц. Были лишь одиночные достижения на частотах 11.5 ТГц без магнитного поля и 9.7 ТГц с магнитным полем [2], 7.5 ТГц [3] и 6.5 ТГц [4]. Во всех случаях материалом служил твердый раствор $Pb_{1-x}Sn_xSe$.

Известно, что гетеролазеры на основе узкозонных полупроводников типа A^{IV}B^{VI} имеют такие достоинства, как низкая пороговая плотность тока и повышенная рабочая температура. Однако по практическим соображениям они уступают диффузионным лазерам, так как для изготовления гетеролазеров требуются хорошие подложки "epi-ready", эпитаксиальная технология и переход к четырехкомпонентным твердым растворам. Например, для твердых растворов $Pb_{1-x}Sn_xTe$ и $Pb_{1-x}Sn_xSe$, соответствующих области спектра излучения около 40 мкм, и для типичных бинарных подложек PbTe и PbSe рассогласование постоянных решетки $\Delta a/a$ достигает соответственно 0.6 и 0.2%. Это снижает срок службы гетеролазеров. Диодные лазеры с диффузионным *p*-*n*-переходом отличаются большим сроком службы, хотя для практических применений работают при низких температурах (< 100 K).

Целью работы являлась систематизация данных по диффузионным лазерам на основе твердого раствора $Pb_{1-x}Sn_xSe$ в широком диапазоне составов ($0 \le x \le 0.3$). Представлена технология изготовления лазеров. Приведены значения пороговой плотности тока и спектров излучения в средней ИК и в начале терагерцовой области спектра. В работе иследовалась возможность применения данных лазеров для спектроскопии твердого тела, в частности для магнитоспектроскопии узкозонных полупроводниковых структур на основе HgCdTe.

2. Исследуемые образцы и методика эксперимента

В работе использовались инжекционные полупроводниковые лазеры на основе твердых растворов $Pb_{1-x}Sn_xSe$, работающие в импульсном режиме. Для получения генерации в широком диапазоне длин волн и, в частности, в терагерцовой области подходят два

[¶] E-mail: kirillm@ipmras.ru

0.03

0.051

0.06

0.07

0.085

0.09

0.10

0.11

0.12

0.30

0.3 - 0.5

0.7 - 1.6

0.3 - 0.4

0.3 - 0.8

0.3 - 0.5

0.4 - 0.9

0.5 - 1

0.8 - 1

2 - 4

0.2 - 1

твердых раствора: $Pb_{1-x}Sn_x$ Те и $Pb_{1-x}Sn_x$ Se. Для обоих материалов при изменении состава имеет место инверсия зоны проводимости и валентной зоны, т.е. ширина запрещенной зоны при определенном содержании Sn x_i и определенной температуре обращается в нуль. Для $Pb_{1-x}Sn_x$ Te и $Pb_{1-x}Sn_x$ Se значения x_i составляют соответственно 0.35 и 0.15 при 4 K.

Хотя большинство разработок лазеров выполнено на твердом растворе $Pb_{1-x}Sn_xTe$, нами был выбран твердый раствор $Pb_{1-x}Sn_xSe$ по следующим причинам: 1) он отличается небольшим (~ 2) коэффициентом анизотропии, что важно для снижения междолинной рекомбинации при повышенной температуре и высоких уровнях легирования; 2) кристаллы $Pb_{1-x}Sn_xSe$ легче скалываются по кристаллографической плоскости (100), что облегчает изготовление резонаторов. Следует, однако, отметить, что из-за разницы показателей преломления для рассматриваемых материалов коэффициент отражения *R* на зеркале резонатора для $Pb_{1-x}Sn_x$ Te (R = 54%) несколько выше, чем для $Pb_{1-x}Sn_x$ Se (R = 48%).

Монокристаллы $Pb_{1-x}Sn_xSe \ (0 \le x \le 0.3)$ *n*- и *p*-типа проводимости с размерами $\sim 1\,{\rm cm}$ выращивались методом направленной кристаллизации из паровой фазы. Состав задавался шихтой и определялся методом рентгеновского микроанализа. Далее кристаллы ориентировались и разрезались проволочной пилой на пластинки толщиной ~ 1 мм. Концентрация и подвижность носителей заряда зависели от состава и обычно составляли соответственно $\sim 5 \cdot 10^{18} \, \mathrm{cm}^{-3}$ и $(1{-}2) \cdot 10^4 \, \mathrm{cm}^2 / \mathrm{B} \cdot \mathrm{c}$ при 77 К. В кристаллы п-типа проводимости диффузия проводилась из диффузанта Pb_{0.49}Se_{0.51} при температуре 425-450°С, в кристаллы *р*-типа — из диффузанта Pb_{0.51}Se_{0.49} при температуре 600-650°C. Глубина p-n-перехода при этом варьировалась от 10 до 50 мкм. Лазерные кристаллики выкалывались по плоскостям (100) с длиной резонатора 0.3-0.5 мм. Омические контакты изготавливались путем напыления In и Au соответственно на область *n*- и *p*-типа проводимости с последующим электрохимическим осаждением слоев Au, Pd и In. Сопротивление контактов определялось по наклону прямой ветви вольт-амперной характеристики и для лучших образцов было < 0.05 Ом при 77 К.

В таблице показана зависимость длины волны излучения (λ) и пороговой плотности тока (J_{th}) диодных лазеров от состава и температуры. Измерения проводились в импульсном режиме (длительность импульса 1 мкс, частота повторения 170 Гц). Образцы погружались непосредственно в хладоагент. В качестве приемника излучения служил Ge, легированный Cu, при 10 К. Из таблицы видно, что путем изменения состава твердого раствора Pb_{1-x}Sn_xSe и температуры от 4 до 77 К удается перекрыть область спектра 24–40 мкм отсутствуют другие полупроводниковые лазеры, в том числе и квантовые каскадные лазеры. Заметный разброс длин волн излучения для одного и того же слитка обусловлен неоднородностью шайбы по составу. В таблице указаны

гока диодных лазеров от состава и температуры				
x	$J_{\rm th}, \kappa {\rm A/cm}^2$		λ, мкм	
	4.2 K	77 K	4.2 K	77 K
0	0.3-1	2-4	8.5	7.34

10.2

12.9

13.8

16.5

19.4

20.7

24.8

28.8

36 - 40

13-13.6

1.1 - 2

4 - 12

3 - 10

4 - 5

3 - 7

4 - 10

3 - 6

3 - 8

5 - 15

8 - 15

Зависимость длины волны излучения и пороговой плотности

также типичные интервалы изменения значений пороговой плотности тока для каждого состава и температуры, и видно, что она возрастает с увеличением как содержания Sn, так и температуры. Увеличение пороговой плотности при увеличении содержания Sn обусловлено расширением области гомогенности твердого раствора Pb_{1-x}Sn_xSe. Это приводит к увеличению концентрации точечных дефектов (вакансий металла и селена), что в конечном итоге снижает внутренний квантовый выход излучения. Для лазеров с x < 0.06 и пороговой плотностью тока до 1 кА/см² реализуется непрерывный режим при температурах вплоть до 20 К.

Интерес представляет также лазер с составом за точкой инверсии (x = 0.30). В этом случае коэффициенты изменения ширины запрещенной зоны под влиянием внешнего воздействия (температура, давление, магнитное поле) имеют противоположные знаки по отношению к материалам до точки инверсии. Эти лазеры не были оптимизированы, поэтому пороговая плотность тока получается относительно высокой.

Лазеры работают в одномодовом режиме при небольшом (десятки процентов) превышении тока над пороговым значением. При сильном превышении тока в спектре излучения появляется серия эквидистантных продольных мод, на часть из которых наложены поперечные моды, так как резонатор образован путем скалывания четырех сторон. Для использования отдельной моды необходимо выделять моду с помощью монохроматора. Однако полная ширина спектра генерации получается относительно небольшой (десятки см⁻¹ в зависимости от накачки лазера и температуры). Следовательно, такой источник излучения может быть использован для спектроскопии конденсированных сред.

Исследования спектров излучения лазеров в данной работе проводились при низких температурах, T = 18-80 К, лазер размещался в вакууме на медном хладопроводе в гелиевом криостате замкнутого цикла. Все измерения проводились в импульсном режиме (дли-

8.9

10.3

10.6 - 11.1

11.9-13.1

13.6-14.1

16.7 - 17

18.2 - 19

21.8

17.5

14.8

тельность импульса 1 мкс, период 500 мкс). Для питания лазеров использовался электронный ключ, позволяющий получать импульсы с заданными длительностью, скважностью и амплитудой, а также измерять напряжение и ток, проходящий через лазер. Пороговый ток, в зависимости от длины волны излучения лазеров и рабочей температуры, варьировался от 0.5 до 12.5 А. Для записи спектров излучения использовался фурье-спектрометр BRUKER Vertex 80v с возможностью работы в режиме пошагового сканирования. Разрешение спектрометра составляло 4 см⁻¹.

Для демонстрации возможности применения лазеров в спектроскопии полупроводников исследовались магнитопоглощение эпитаксиальной пленки $Hg_{0.826}Cd_{0.174}$ Te и гетероструктуры $HgTe/Cd_{0.7}Hg_{0.3}$ Te (номинальная толщина квантовой ямы составляла 6.3 нм) при T = 4.2 К. В качестве приемников использовались кристаллы Ge:Zn. Прошедшее через образец излучение детектировалось приемником, сигнал с него усиливался и подавался на строб-интегратор.

3. Результаты и обсуждение

На рис. 1 представлены спектры излучения инжекционных PbSnSe-лазеров различного состава, полученные в диапазоне температур от 18 до 80 К (для лазеров 1156, 1159, 63n и 1144 состав соответствует содержанию Sn x = 0.10, 0.11, 0.12, 0.65). Хорошо видно, что имеющийся набор лазеров при варьировании температур в указанном интервале позволяет перекрыть диапазон от 7 до 26 ТГц. Отметим, что частота излучения определяется шириной запрещенной зоны, а следовательно, может практически непрерывно перестраиваться в рабочем интервале температур. Поскольку, как уже отмечалось во Введении, существующие ККЛ не могут работать в



Рис. 1. Спектры излучения лазерных диодов на основе $Pb_{1-x}Sn_xSe$ различного состава, (номера образцов указаны) при температурах 18 (1), 40 (2), 60 (3), 70 (4), 80 K (5). Спектральное разрешение 4 см⁻¹.



Рис. 2. Спектр магнитопоглощения в эпитаксиальной пленке $Hg_{0.826}Cd_{0.174}$ Te, снятый с помощью PbSnSe-лазера при T = 4.2 K.



Рис. 3. Спектр магнитопоглощения в гетероструктуре $HgTe/Cd_{0.7}Hg_{0.3}Te$, снятый с помощью PbSnSe-лазера при T = 4.2 K.

диапазоне 5–11 ТГц, данные лазеры оказываются уникальными для прикладных и научных исследований.

Для демонстрации возможности применения лазеров для задач спектроскопии использовались эпитаксиальная пленка $Hg_{0.826}Cd_{0.174}Te$ и гетероструктура $HgTe/Cd_{0.7}Hg_{0.3}Te$ при T = 4.2 К. На рис. 2 представлена зависимость пропускания эпитаксиальной пленки от величины магнитного поля *B*. В спектре наблюдается мощная линия поглощения. Положение и интенсивность этой линии соотвествует межзонному переходу (между уровнями Ландау подзоны тяжелых дырок и зоны проводимости) $2 \rightarrow -1$ [5]. Спектр пропускания, измеренный в гетероструктуре $HgTe/Cd_{0.7}Hg_{0.3}Te$, представлен на рис. 3. В спектре наблюдается одна достаточно широкая линия. Положение этой линии хорошо согласуется с предыдущими исследованиями, выполненными методами фурье-спектроскопии [6].

1675

Заключение

Таким образом, на основе твердого раствора $Pb_{1-x}Sn_xSe$ разработаны диффузионные лазеры для широкой области спектра (7–40 мкм). Исследованы спектры излучения этих лазеров $Pb_{1-x}Sn_xSe$ в интервале температур T = 18-80 К. Показано, что лазеры перестраиваются с температурой в широких пределах, что позволяет перекрыть диапазон частот 7–26 ГГц. Показана возможность использования данных лазеров для спектроскопии твердого тела и, в частности, для магнитоспектроскопии узкозонных полупроводниковых структур HgCdTe.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 15-02-05470) и РАН. В работе использовано оборудование ЦКП "Физика и технология микро- и наноструктур".

Список литературы

- D. Van der Weide. Optics & Photonics News, 14 (4), 48 (2003).
- [2] A.R. Calawa, J.O. Dimmock, T.C. Harman, I. Melngailis. Phys. Rev. Lett., 23, 7 (1969).
- [3] И.И. Засавицкий. Тр. ФИАН (Оптические и электрические свойства полупроводников), **224**, 3 (1993).
- [4] Л.Н. Курбатов, А.Д. Бритов, С.М. Караваев, С.Д. Савченко, С.Н. Максимовский, И.И. Овчинников, М.М. Рзаев, П.М. Старик. Письма ЖЭТФ, 37, 422 (1983).
- [5] А.В. Иконников, М.С. Жолудев, В.И. Гавриленко, Н.Н. Михайлов, С.А. Дворецкий. ФТП, 47, 1569 (2013).
- [6] M.S. Zholudev, A.V. Ikonnikov, F. Teppe, M. Orlita, K.V. Maremyanin, K.E. Spirin, V.I. Gavrilenko, W. Knap, S.A. Dvoretskiy, N.N. Mikhailov. Nanoscale Res. Lett., 7, 534 (2012).

Редактор Л.Я. Шаронова

The long-wave injection lasers based on solid solution $Pb_{1-x}Sn_xTe$ and their use in solid-state spectroscopy

K.V. Maremyanin^{+*}, A.V. Ikonnikov^{+*},
A.V. Antonov^{+*}, V.V. Rumyantsev^{+*}, S.V. Morozov^{+*},
L.S. Bovkun⁺, K.R Umbetalieva[‡], E.G. Chizhevskiy[‡],
I.I. Zasavitskiy[‡], V.I. Gavrilenko^{+*}
⁺ Institute for Physics of Microstructures,
Russian Academy of Sciences,
603950 Nizhniy Novgorod, Russia
* Lobachevsky State University of Nizhniy Novgorod,
603950 Nizhny Novgorod, Russia
[‡] Lebedev Physical Institute,

Russian Academy of Sciences,

119991 Moscow, Russia

Abstract Diffusion lasers on the basis of $Pb_{1-x}Sn_xSe$ solid solution were developed for a wide spectral range $(7-40 \,\mu m)$. The emission spectra of these lasers were investigated in the temperature range 18–80 K. It is shown that emission wavelength can be continuously adjusted in a wide spectral range by changing the operating temperature allowing to cover 7-26 THz spectral range. The possibility of implementing these lasers for spectroscopy of solids, in particular magneto-optical spectroscopy of narrow-gap HgCdTe based structures, is demonstrated.